Pismo: KC-zp.272-554/19 Kraków, 2019-08-21

**WYKONAWCY,**

**którzy pobrali SIWZ**

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

W dniu **2019-08-20** wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „**przetarg nieograniczony”**, którego przedmiotem jest **dostawa spektrometru fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją falową (WD-XRF) do ilościowej analizy składu pierwiastkowego próbek stałych oraz ciekłych dla ACMiN AGH - KC-zp.272-554/19.**

**Treść zapytania brzmi następująco:**

1. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza, aby lampa rentgenowska umieszczona była pod analizowaną próbką?

Uzasadnienie: Umieszczenie lampy pod analizowaną próbką jest najczęściej stosowanym rozwiązaniem w spektrometrii rentgenowskiej, jako to najbardziej niezawodne i pozwalające na najbardziej precyzyjną analizę powierzchni próbki. W przeciwieństwie do rozwiązania polegającego na umieszczeniu lampy nad próbką, w trakcie pomiaru nie dochodzi do osadzania się pyłu na okienku lampy, czego rezultatem są błędne wyniki pomiarów i szybsze starzenie się lampy prowadzące do znaczengo wzrostu kosztów ekspoloatacji. W rozwiązaniu proponowanym przez naszą firmę lampa umieszczona jest pod analizowaną próbką i pokryta jest dodatkową ochronną powłoką, która ponad 50x krotnie zwiększa odporność okienka lampy na ewentualne zalanie go nawet NaOH. Ponadto komora spektrometru wyposażona jest w automatyczny układ odpylania, który zapobiega osadzaniu się pyłu z próbki zarówno na okienku lampy jak i komorze pomiarowej. Najistotniejszą jednak cechą rozwiązania polegającego na umieszczeniu lampy pod probką jest powtarzalne i precyzyjne pozycjonowanie próbki w trakcie każdego pomiaru.

2. Pytanie: Czy Zamawiający wymaga systemu mapowania próbki w oparciu o tradycyjną metodę WDXRF czy ultra-nowoczesną metodę EDXRF?

Uzasadnienie: Mapowanie przy wykorzystaniu metody EDXRF jest najnowocześniejszym rozwiązaniem, polegającym na symultanicznej analizie plamki pomiarowej, co w przypadku małej średnicy plamki oraz kroku pomiarowego mapowania pozwala na znaczne skrócenie casu pomiarowego (nawet kilka dni!) w stosunku do metody tradycyjnej opartej w pomiarach sekwencyjnych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

1) Zamawiający wymaga, aby lampa umieszczona była nad powierzchnią analizowanej próbki.

2) Aparat ma umożliwiać prowadzenie pomiarów techniką WD-XRF.

 KANCLERZ

 mgr inż. Henryk Zioło